

ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: hht@nt-rt.ru || www.hitpribor.nt-rt.ru

Аналитический сканирующий микроскоп SU5000 Технические характеристики



SU5000 - это многозадачный РЭМ с катодом Шоттки, прекрасно подходящий для решения широкого круга аналитических задач. Благодаря новому источнику электронов, который обеспечивает стабильный ток пучка в диапазоне от 1пА до 200 нА, микроскоп совмещает возможность ультра быстрого анализа и высокого разрешения. В приборе используется конструкция объективной линзы типа Out-of-Lens, что даёт возможность работы с магнитными образцами. Камера микроскопа имеет порты для установки всех распространённых аналитических приставок, включая EDS, WDS и EBSD. Работа с чувствительными образцами возможна благодаря режиму торможения электронов (до 100В). Непроводящие или влажные образцы могут быть просмотрены в режиме неглубокого вакуума (VP-SEM), причём переход в этот режим осуществляется нажатием одной кнопки в управляющей программе. Для режима VP-SEM доступен специальный детектор вторичных электронов (UVD детектор).

Технические характеристики

Разрешение, полученное во вторичных электронах	1,2 нм на 30 кВ 2 нм на 1 кВ
Электронная оптика	
Ускоряющее напряжение	0,5 кВ — 30кВ
Столик для камеры образцов	Увеличение x20 — x800 000
Перемещение, мм	
Наклон	X, Y: 110/50 мм, Z: 3-65
Вращение	от -20° до 90° 360°



(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(8412)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)22948 -12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93